

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-195900
(P2000-195900A)

(43) 公開日 平成12年7月14日 (2000.7.14)

(51) Int.Cl.
H 0 1 L 21/60

識別記号
3 1 1

F I
H 0 1 L 21/60

テーマコード(参考)
3 1 1 S 5 F 0 4 4

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平10-368621

(22) 出願日 平成10年12月25日 (1998. 12. 25)

(71) 出願人 000004260

株式会社デンソー

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

(72) 発明者 野々山 和美

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
社デンソー内

(72) 発明者 井野 功治

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
社デンソー内

(74) 代理人 100067596

弁理士 伊藤 求馬

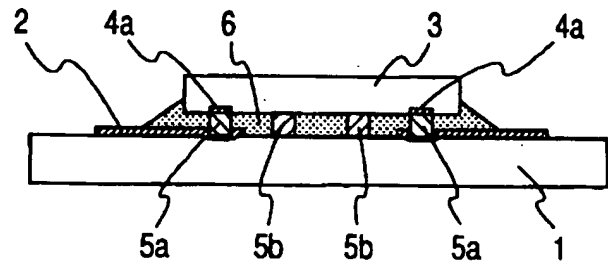
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57) 【要約】

【課題】 半導体装置において半導体チップの実装品質を高めることである。

【解決手段】 回路基板1の上面に形成した回路電極2と、半導体チップ3の下面に回路電極2と対向する位置に形成したバンプ5aとの間に、これらを電気的かつ機械的に結合せしめる異方性導電接合材6を介した半導体装置において、半導体チップ3の下面に、回路基板1の回路電極非形成の部位と対向する位置に、ダミーバンプ5bを形成することで、異方性導電接合材6を圧縮、変形せしめるための半導体チップ3への印加荷重を、安定性のよい高荷重側に設定したときに、その荷重がダミーバンプ5bに分散するようにし、過剰な荷重印加で回路基板1が変形したり回路電極2が断線しないようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 回路基板の上面に形成した回路電極と、半導体チップの上記回路電極と対向する位置に形成したパンプとの間に、これらを電氣的かつ機械的に接合せしめる異方性導電接合材を介設した半導体装置において、上記半導体チップの下面には、上記回路基板の回路電極非形成の部位と対向する位置に、ダミーパンプを形成したことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 請求項1記載の半導体装置において、上記ダミーパンプを半導体チップの検査パッド表面に形成した半導体装置。

【請求項3】 請求項1または2いずれか記載の半導体装置において、上記回路基板を樹脂製フィルムにより形成し、上記回路電極を導電性接着ペーストにより形成した半導体装置。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明は半導体装置に関し、特に半導体チップの回路基板への実装に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年の半導体チップの回路基板への実装技術の動向は、電子機器の超小型化、高密度化に伴い、微細化、薄型化の傾向にある。半導体チップと回路基板との間の接合方法として、従来からのワイヤボンディング、はんだ付けよりも微細化、薄型化のできる異方性導電接合が大いに注目されている。異方性導電接合は、回路基板上の所定の半導体チップ実装位置に、内部に導電性粒子を均一分散させた異方性導電接合材を塗布又は貼付けした後、この上に半導体チップを載置し、これらに加熱および上下方向の加圧を行うものである。これにより、異方性導電接合材が、半導体チップの下面に形成されたパンプと、回路基板の回路パターンとの途中または端部に形成された導通接続用の回路電極との間に挟まれ圧縮して、この異方性導電接合材中の導電粒子によりパンプと回路電極の間を導通するとともに、異方性導電接合材が加熱により硬化して半導体チップと回路基板とを機械的に結合する。

【0003】 回路基板は、従来、弾性率21GPa程度のガラスエポキシ基板やガラス基板等の硬い材質の基板が一般的であったが、近年、ICカード等の薄型の半導体装置の登場により柔軟な基板も用いられている。図4はICカードの代表例を示すもので、一方の意匠シートを構成する回路基板71表面には巻線状のアンテナパターン73が形成され、回路基板73上に実装された半導体チップ74が、図示しないパンプにてアンテナパターン73の端部に形成された回路電極と導通する。これらの上には他方の意匠シート72が被覆、接着される。かかるICカード等では、回路基板71は柔軟性のある弾性率6GPa程度のポリエステル(PET)樹脂等を

れる。

【0004】 ところで、半導体チップの実装装置は、半導体チップの上面に加圧用の荷重を印加する荷重印加装置を含み構成されている。半導体チップの実装品質を揃えるには、一般に印加荷重の誤差割合が小さく印加荷重が安定している荷重領域で用いるのが望ましい。この場合、従来のガラスエポキシ基板等の硬い材質のものは、印加荷重が安定するある程度高い荷重領域を用いることで、確実な導通を得ることが容易である。しかしながら、上記柔軟な回路基板では、印加荷重が安定する高い荷重領域を用いると、図5に示すように、荷重が集中する半導体チップ74のパンプ75が回路基板71に食い込み、回路基板71の変形や回路電極731の断線を引き起こしたり、接合耐久性が低下する。柔軟な材質の回路基板用に実装装置を新たに開発できればよいが、技術的に困難が伴うとともに、できたとしても設備費用が嵩む。また、半導体チップの実装ラインを硬い材質の回路基板用と柔軟な材質の回路基板用とで別々にする必要があり、到底容認できない。

【0005】 特開平9-92683号公報には、半導体チップが実装されない回路基板の背面に銅箔等の補強板を設けて、荷重印加により回路基板が変形しても荷重解除後に補強板の弾性反発力により回路基板の変形部を復元するようにしたものが記載されており、この技術を適用して高荷重での半導体チップの実装を行うことが考えられる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記特開平9-92683号公報記載の技術では、回路基板は荷重印加により一旦は大きく変形するから、変形部が必ずしも満足に復元せず、ICカード等において半導体チップを実装後に回路基板の下面に意匠印刷等を施す際に印刷むらや印刷欠陥の影響が見れるおそれがある。また、一旦、断線した回路電極を修復する作用を奏するわけではない。

【0007】 本発明は上記実情に鑑みなされたもので、半導体チップ実装時に高荷重を印加しても回路基板の変形や回路電極断線を防止することのできる半導体装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】 請求項1記載の発明では、半導体チップの下面に、回路基板の上面に形成した回路電極と対向する位置に形成するパンプに加え、上記回路基板の回路電極非形成の部位と対向する位置にダミーパンプを形成する。

【0009】 ダミーパンプを設けることにより、回路基板と半導体チップ間に介設される異方性導電接合材を加圧するために半導体チップに印加される荷重がダミーパンプに分散され、印加荷重が高くとも回路基板の変形や

て安定性のよい高荷重の印加が可能となる。

【0010】請求項2記載の発明では、上記ダミーバンプを半導体チップの検査パッド表面に形成する。

【0011】これにより、検査パッドの表面は、他のバンプ形成位置と同様にバンプ用の成膜がなされた後、露出せず、その腐食を防止することができる。

【0012】請求項3記載の発明では、上記回路基板を樹脂製フィルムにより形成し、上記回路電極を導電性接着ペーストにより形成する。

【0013】高荷重印加により回路基板変形が生じやすい樹脂製フィルム、および高荷重印加により回路電極断線が生じやすい導電性接着ペーストを用いたときに、実装品質を高める特に絶大な効果を得ることができる。

【0014】

【発明の実施の形態】本発明の半導体装置の実施形態を、図1、図2により説明する。図1はフリップチップの回路基板への実装状態を示し、図2はフリップチップの回路面に形成したバンプを示している。回路基板1にはフリップチップ実装位置に異方性導電接合材たる異方性導電接着フィルム6が設けられ、その上に矩形のフリップチップ3が載置してある。

【0015】フリップチップ3の下面には、その四隅に形成された、フリップチップ3の内部回路に通じるパッド4a上に導通接続用のバンプ5aが突設してある。導通接続用バンプ5aと回路基板1に形成した回路電極2とは互いに対向するように形成される。フリップチップ3の下面には、導通接続用バンプ5aとは別に、回路基板1の電極非形成の部位と対向する位置に、図2中、手前側の両導通接続用バンプ5aの間、および奥側の両導通接続用バンプ5aの間に、それぞれ2つつつダミーバンプ（以下、適宜バンプともいう）5bが突設してある。手前側のバンプ5a、5bおよび奥側のバンプ5a、5bは、それぞれ略等間隔に配置される。

【0016】ダミーバンプ5bは導通接続用バンプ5a形成時に、これと一緒に形成される。すなわち、ウェハプロセスにおいて、チタン（Ti）-クロム（Cr）等のUBM（Under Bump Metal）膜をスパッタ等により形成後、フォトリソグラフィーを援用してバンプ形成位置に選択的に、メッキや蒸着によりバンプとなる金属の凸部を形成し、フォトリソ除去後、金属膜非形成のUBM膜を選択エッチングしてバンプ5a、5bが完成する。したがって導通接続用バンプ5aとダミーバンプ5bとは高さが実質的に同じである。

【0017】半導体チップ3の下面から突設された導通接続用バンプ5aとダミーバンプ5bとは、いずれも、回路基板1に仮圧着された異方性導電接着フィルム6上に載置した後、半導体チップ実装装置の加圧加熱ヘッドを半導体チップ3の上面に押し付けて荷重を印加することにより、下側の異方性導電接着フィルム6等を押圧す

ブ5bとは高さが実質的に同じであるから、すべてのバンプ5a、5bがバランスよく異方性導電接着フィルム6と圧接する。そして、異方性導電接着フィルム6は回路基板1とバンプ5a、5bとで挟まれた位置のみ大きな加圧力を受けて圧縮変形する。これにより、回路基板1の回路電極2と導通接続用のバンプ5aとの間は導通する。一方、ダミーバンプ5bは回路基板1の回路電極2と非対向であるから、回路基板1とダミーバンプ5bとの間の異方性導電接着フィルム6は導通には寄与しない。

【0018】ここで、半導体チップ3への印加荷重は4つの導通接続用バンプ5a、4つのダミーバンプ5bに分散し、実装装置の印加荷重が大きなものであっても、各バンプ5a、5bにおける荷重は大きなものにはならない。図例では導通接続用バンプ5aと同じ数のダミーバンプ5bが設けてあるから、導通接続用バンプ5aに印加される荷重は、ダミーバンプ5bを有しない従来の半導体装置に比して略半減する。しかして、導通接続用バンプ5aにより回路基板1が変形することが防止され、勿論、ダミーバンプ5bでも回路基板1が変形は生じない。また、回路電極2も導通接続用バンプ5aにより押圧されることにより回路基板1側へ凹むことはあっても断線は生じず、導通接続用バンプ5aとの接合耐久性も損なうことはない。しかして、加圧加熱ヘッドによる印加荷重を高い値に設定して印加荷重の安定性を高めることと、回路基板1の変形や回路電極2の断線の防止とを両立することができる。

【0019】次に本発明の実施例について実装品質を評価して結果について説明する。実施例は、図2に示すように導通接続用バンプ5aと、荷重分散用のダミーバンプ5bとをそれぞれ4つつつ設けたもので、回路基板1は厚さ100 μ mのPET樹脂シートに導電性接着ペーストによる印刷で電極を形成した。各バンプ5a、5bは金（Au）メッキにより100 μ m \square 、高さ20 μ mに形成した。異方性導電フィルム6はシート状エポキシ樹脂に導電性粒子を配合したものをを用いた。そして、回路基板1にはフリップチップ実装位置に異方性導電接着フィルム6を仮圧着し、その上にフリップチップ3を、導通接続用バンプ5aと、対応する回路基板1の回路電極2とが一致するように重ねて載置し、その状態で加圧加熱ヘッドによりフリップチップ3の上から荷重を印加して本圧着をおこなった。仮圧着は80 $^{\circ}$ C、200gf/チップ、3秒の条件で行い、続く本圧着は190 $^{\circ}$ C、500gf/チップ、20秒の条件で行った。なお、上記本圧着荷重は半導体チップ実装装置において、荷重が安定する荷重領域の値である。

【0020】一方、比較例として、ダミーバンプが非形成である点を除き実施例と同じ仕様のものを用意した。

【0021】表1に実施例および比較例についての品質

板の変形が生じたのに対して、実施例ではこのような不具合は発生しなかった。また、接合耐久性については、比較例では雰囲気温度70°Cのもとで850時間で導通不良が発生したのに対して、実施例では1000時間

以上を経てなお導通性は良好であった。

【0022】

【表1】

	比較例 (ダミーバンプなし)	実施例 (ダミーバンプあり)
実装荷重	500gf / チップ	←
接合状態	・回路電極の切断 ・回路基板の変形	接合状態良好
接合耐久性	70℃×850hr にて 導通不良発生	70℃×1000hr 以上で 導通性良好

【0023】このように、本発明では荷重を分散せしめるダミーバンプを設けることで、ICカード等の柔軟な回路基板を用いる半導体装置であっても、印加荷重が安定する高荷重での実装が可能となる。ここで、ダミーバンプは上記のごとく、導通接続用バンプと一緒に形成されるから、バンプ形成用のフォトマスクの変更のみで対応することができる。したがって、半導体チップ実装装置を新たに導入する必要もなく、実装ラインを回路基板の材質の種類によらず共通に構成できる。

【0024】なお、ダミーバンプの設置位置、形状、数等は、実装装置の荷重安定性等に応じて要求される設定荷重により適宜選択するのがよく、例えば、ICカードに用いられるフリップチップのように導通接続用のバンプの数が少ないほど、荷重安定性に応じた要求される印加荷重が高いほどダミーバンプの数を多くする。また、ダミーバンプの形成位置は、半導体チップの下面にできるだけ均等に配置するのがよい。なおダミーバンプは必ずしも導通接続用のバンプの間にある必要はない。

【0025】また、ダミーバンプ5bはそのうちの一部もしくは全部を、図3に示すように、半導体チップ3の下面に、パッド4aとは別に形成されて半導体チップ3の性能検査に用いられる検査用のパッド4bの表面に設けるのもよい。この場合、次の効果を奏する。すなわち、検査用パッドにバンプを形成しないものでは、検査用パッドは、上記バンプ形成時にUBM膜がエッチング除去されることにより表面が露出することになる。検査用パッドには、通常、バンプに用いるAu等よりも耐蝕性が劣るアルミニウム等が用いられるから、UBM膜の

エッチングやその後の洗浄工程等においてダメージを受け腐食をもたらすおそれがある。これに対して検査用パッドにダミーバンプを形成したものでは、検査用パッド4bの表面が上記UBM膜の形成後、露出することがないから、検査用パッド4bの腐食を防止することができる。

【0026】また、異方性導電接合材として異方性導電接着フィルムを用いているが、液状のものでも勿論よい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体装置の半導体チップ実装状態を示す図である。

【図2】本発明の半導体装置の半導体チップの下面側の斜視図である。

【図3】本発明の半導体装置の変形例の半導体チップ実装状態を示す図である。

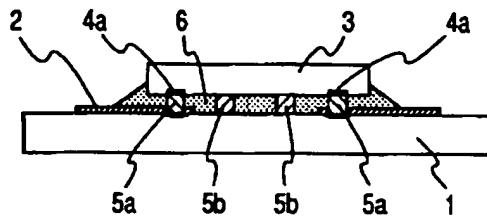
【図4】ICカードの代表例の分解斜視図である。

【図5】従来の半導体装置の半導体チップ実装状態の代表例を示す図である。

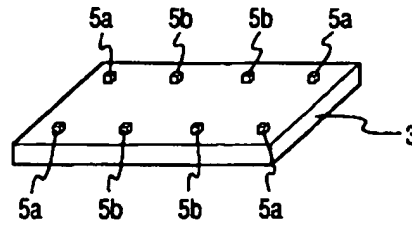
【符号の説明】

- 1 回路基板
- 2 回路電極
- 3 半導体チップ
- 4b 検査用のパッド
- 5a バンプ
- 5b ダミーバンプ
- 6 異方性導電接着フィルム（異方性導電接合材）

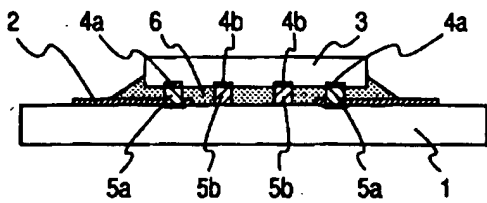
【図1】



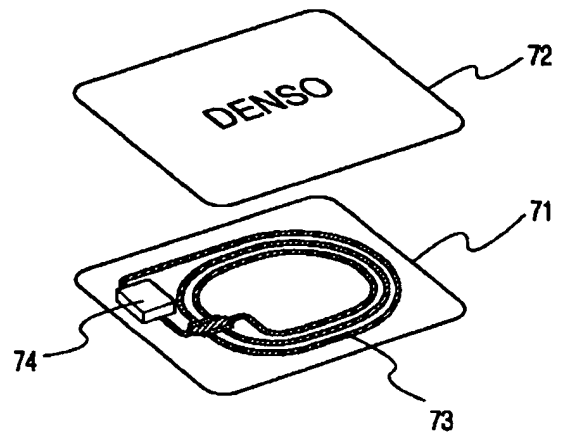
【図2】



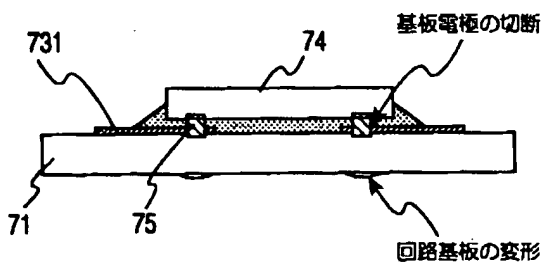
【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 平田 達也
愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
社デンソー内

Fターム(参考) 5F044 KK03 KK11 LL09 QQ02

2000-195900

SEMICONDUCTOR DEVICE

[Claim(s)]

[Claim 1] The semiconductor device characterized by to form a dummy bump in the position which counters with the part of the circuit electrode agenesis of the above-mentioned circuit board on the undersurface of the above-mentioned semiconductor chip in the semiconductor device which interposed the anisotropy electric-conduction jointing material which patches these electrically and mechanically between the circuit electrode formed in the upper surface of the circuit board, the above-mentioned circuit electrode of a semiconductor chip, and the bump who formed in the position which counters, and closes them to it.

[Claim 2] The semiconductor device which formed the above-mentioned dummy bump in the inspection pad front face of a semiconductor chip in the semiconductor device according to claim 1.

[Claim 3] A claim 1 or the semiconductor device which formed the above-mentioned circuit board with the film made of a resin, and formed the above-mentioned circuit electrode with a conductive adhesion paste in the semiconductor device of a publication 2 either.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] Especially this invention relates to mounting to the circuit board of a semiconductor chip about a semiconductor device.

[0002]

[Description of the Prior Art] The trend of the mounting technology to the circuit board of a semiconductor chip in recent years is in the inclination of thin-shape[detailed-izing and]-izing in connection with the microminiaturization of electronic equipment, and densification. As the junction method between a semiconductor chip and the circuit board, the anisotropy electric conduction junction which can perform detailed-izing and thin shape-ization rather than wirebonding from the former and soldering greatly attracts attention. After anisotropy electric conduction junction applies or sticks on the interior anisotropy electric conduction jointing material which carried out uniform distribution of the conductive particle, it lays a semiconductor chip on this and performs pressurization of heating and the vertical direction to these in the predetermined

semiconductor chip mounting position on the circuit board. While anisotropy electric conduction jointing material is inserted between the bump formed in the inferior surface of tongue of a semiconductor chip, and the circuit electrode for flow connection formed in the edge in the middle of the circuit pattern of the circuit board, compresses and flows through between a bump and circuit electrodes by this by the electric conduction particle in this anisotropy electric conduction jointing material, anisotropy electric conduction jointing material hardens by heating, and combines a semiconductor chip and the circuit board mechanically.

[0003] Although the substrate of the circuit board of the stiff quality of the materials, such as a glass epoxy-group board of about 21 GPas of elastics modulus and a glass substrate, was common conventionally, the flexible substrate is also used by the appearance of the semiconductor device of thin shapes, such as an IC card, in recent years. The example of representation of an IC card is shown, the antenna pattern 73 of a wound is formed in circuit board 71 front face which constitutes one design sheet, and drawing 4 flows with the circuit electrode formed in the edge of an antenna pattern 73 by the bump whom the semiconductor chip 74 mounted on the circuit board 73 does not illustrate. On these, the design sheet 72 of another side is covered and it pastes up. In this IC card, what fabricated thinly the polyester (PET) resin of about 6 GPas of elastics modulus with which the circuit board 71 is supple in the shape of a sheet to about 0.1mm is used.

[0004] By the way, the mounting equipment of a semiconductor chip is constituted including the load impression equipment which impresses the load for pressurization to the upper surface of a semiconductor chip. In order to arrange the mounting quality of a semiconductor chip, it is desirable to use in the load field whose impression load the error rate of an impression load is small and is generally stable. In this case, in the thing of the stiff quality of the materials, such as the conventional glass epoxy-group board, it is easy to obtain a positive flow by using the to some extent high load field by which an impression load is stabilized. however, the above -- in the flexible circuit board, if the high load field by which an impression load is stabilized is used, as shown in drawing 5 , the bump 75 of the semiconductor chip 74 which a load concentrates eats into the circuit board 71, deformation of the circuit board 71 and an open circuit of the circuit electrode 731 will be caused, or junction endurance will fall Although what is necessary is just to be newly able to develop mounting equipment to the circuit boards of the flexible quality of the material, though it can do while difficulty follows technically, facility costs increase. Moreover, it is necessary to make the mounting line of a semiconductor chip separate, and it cannot be admitted at all by the object for the

circuit boards of the stiff quality of the material, and the object for the circuit boards of the flexible quality of the material.

[0005] Back up plates, such as ****, are prepared in the tooth back of the circuit board at which a semiconductor chip is not mounted, even if the circuit board deforms by load impression, what restored the variant part of the circuit board by the elastic repulsive force of a back up plate is indicated after load release by JP,9-92683,A, and it is possible to mount the semiconductor chip in a high load with the application of this technology.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] however -- since 1 ** transforms the circuit board greatly by load impression with technology given [above-mentioned] in JP,9-92683,A -- a variant part -- surely -- also carrying out -- it does not restore to satisfaction, but after mounting a semiconductor chip, in case design printing etc. is given to the inferior surface of tongue of the circuit board in an IC card etc., there is a possibility that the influence of printing unevenness or a printing defect may appear Moreover, the operation which once restores the disconnected circuit electrode is not necessarily done so.

[0007] this invention was made in view of the above-mentioned actual condition, and even if it impresses a high load at the time of semiconductor chip mounting, it aims at offering the semiconductor device which can prevent deformation of the circuit board and a circuit electrode open circuit.

[0008]

[Means for Solving the Problem] A dummy bump is formed in the circuit electrode formed in the upper surface of the circuit board on the undersurface of a semiconductor chip, and the position which counters with the part of the circuit electrode agenesis of the above-mentioned circuit board in addition to the bump who forms in the position which counters in invention according to claim 1.

[0009] By preparing a dummy bump, in order to pressurize the anisotropy electric conduction jointing material interposed between the circuit board and a semiconductor chip, the load impressed to a semiconductor chip is distributed by the dummy bump, and an open circuit of deformation of the circuit board and the electrode of the circuit board can be prevented as an impression load is high. A deer is carried out and the good impression of a high load of stability is attained.

[0010] The above-mentioned dummy bump is formed in the inspection pad front face of a semiconductor chip in invention according to claim 2.

[0011] Thereby, it cannot expose but the front face of an inspection pad can prevent the corrosion, after the membrane formation for bumps is made like other bump formation

positions.

[0012] In invention according to claim 3, the above-mentioned circuit board is formed with the film made of a resin, and the above-mentioned circuit electrode is formed with a conductive adhesion paste.

[0013] When the film made of a resin which circuit board deformation tends to produce by high load impression, and the conductive adhesion paste which a circuit electrode open circuit tends to produce by high load impression are used, the greatest effect which raises mounting quality can be acquired especially.

[0014]

[Embodiments of the Invention] Drawing 1 and drawing 2 explain the operation form of the semiconductor device of this invention. Drawing 1 shows the mounting state to the circuit board of a flip chip, and drawing 2 shows the bump who formed in the circuit side of a flip chip. The anisotropy electric conduction jointing-material slack anisotropy electric conduction adhesive film 6 is formed in a flip chip mounting position at the circuit board 1, and the rectangular flip chip 3 is laid on it.

[0015] Bump 5a for flow connection has protruded on the undersurface of a flip chip 3 on pad 4a which leads to the internal circuitry of a flip chip 3 formed in the four corners. Bump 5a for flow connection and the circuit electrode 2 formed in the circuit board 1 are formed so that it may counter mutually. Two have protruded at a time on the position which counters the undersurface of a flip chip 3 with the part of the electrode agenesis of the circuit board 1 apart from bump 5a for flow connection in dummy bump (suitably henceforth bump) 5b among drawing 2, respectively between bump 5a for both flow connection between bump 5a for both flow connection of a near side, and by the side of the back. The bumps 5a and 5b of a near side and the bumps 5a and 5b by the side of the back are stationed at abbreviation regular intervals, respectively.

[0016] Dummy bump 5b is formed together with this at the time of the bump 5a formation for flow connection. That is, in a wafer process, the heights of the metal which uses after formation and Fort Lee SOGURAI for by the spatter etc., and becomes a bump formation position with a bump by plating or vacuum evaporationo alternatively about UBM (Under Bump Metal) films, such as (Titanium Ti)-chromium (Cr), are formed, after photoresist removal, selective etching of the UBM film of metal membrane agenesis is carried out, and Bumps 5a and 5b complete. Therefore, bump 5a for flow connection and dummy bump 5b have substantially the same height.

[0017] After laying each of bump 5a for flow connection which protruded from the inferior surface of tongue of a semiconductor chip 3, and dummy bump 5b on the anisotropy electric conduction adhesive film 6 by which temporary sticking by pressure

was carried out at the circuit board 1, it presses lower anisotropy electric conduction adhesive-film 6 grade by forcing the pressurization heating head of semiconductor chip mounting equipment on the upper surface of a semiconductor chip 3, and impressing a load. Since bump 5a for flow connection and dummy bump 5b have substantially the same height like the above, all the bumps 5a and 5b improves [balance] a pressure welding to the anisotropy electric conduction adhesive film 6. And the anisotropy electric conduction adhesive film 6 carries out the compression set only of the position across which it faced by the circuit board 1 and Bumps 5a and 5b in response to big welding pressure. This flows between the circuit electrode 2 of the circuit board 1, and bump 5a for flow connection. On the other hand, since dummy bump 5b does not counter with the circuit electrode 2 of the circuit board 1, the anisotropy electric conduction adhesive film 6 between the circuit board 1 and dummy bump 5b does not contribute to a flow.

[0018] Here, the impression load to a semiconductor chip 3 is distributed to four bumps 5 for flow connection a, and four dummy bump 5b, and even if the impression load of mounting equipment is big, the load in each bumps 5a and 5b will not become big. In the example of drawing, since dummy bump 5b of the same number as bump 5a for flow connection is prepared, the load impressed to bump 5a for flow connection carries out an abbreviation reduction by half as compared with the conventional semiconductor device which does not have dummy bump 5b. A deer is carried out, it is prevented that the circuit board 1 deforms by bump 5a for flow connection, and, of course, as for deformation, the circuit board 1 does not produce dummy bump 5b, either. Moreover, when the circuit electrode 2 is also pressed by bump 5a for flow connection, even if it may dent to a circuit board 1 side, it is not generated and an open circuit does not spoil junction endurance with bump 5a for flow connection, either. A deer can be carried out and it can be compatible in setting the impression load by the pressurization heating head as a high value, and raising the stability of an impression load, and deformation of the circuit board 1 and prevention of an open circuit of the circuit electrode 2.

[0019] Next, mounting quality is evaluated about the example of this invention, and a result is explained. An example is what prepared bump 5a for flow connection, and every four dummy bump 5b for load distribution, respectively, as shown in drawing 2, and the circuit board 1 formed the electrode in the PET sheet with a thickness of 100 micrometers by printing by the conductive adhesion paste. Each bumps 5a and 5b formed in 100micrometer** and a height of 20 micrometers by golden (Au) plating. The anisotropy electric conduction film 6 used what blended the conductive particle with the sheet-like epoxy resin. And temporary sticking by pressure of the anisotropy electric

conduction adhesive film 6 was carried out in the flip chip mounting position at the circuit board 1, the flip chip 3 was laid in piles so that the circuit electrode 2 of the circuit board 1 corresponding to a it top with bump 5a for flow connection might be in agreement, the upper shell load of a flip chip 3 was impressed by the pressurization heating head in the state, and this sticking by pressure was performed. Temporary sticking by pressure was performed on 80degreeC, 200gf / chip, and the conditions for 3 seconds, and this continuing sticking by pressure was performed on 190degreeC, 500gf / chip, and the conditions for 20 seconds. In addition, this above-mentioned sticking-by-pressure load is the value of the load field by which a load is stabilized in semiconductor chip mounting equipment.

[0020] On the other hand, except for the point that a dummy bump is agenesis, the thing of the same specification as an example was prepared as an example of comparison.

[0021] The quality evaluation result about an example and the example of comparison is shown in Table 1. In the example, such fault was not generated to cutting of a circuit electrode and deformation of the circuit board having arisen in the example of comparison. Moreover, in addition about junction endurance, conductivity was after [example / 1000 hours or more] good to defective continuity having occurred under 70 degrees of ambient temperature C in the example of comparison in 850 hours.

[0022]

[Table 1]

[0023] Thus, by this invention, by preparing the dummy bump who makes a load distribute, even if it is a semiconductor device using the flexible circuit boards, such as an IC card, mounting by the high load by which an impression load is stabilized is attained. Here, since a dummy bump is formed together with the bump for flow connection like the above, she can respond only by change of the photo mask for bump formation. Therefore, it is not necessary to newly introduce semiconductor chip mounting equipment, and a mounting line is not depended on the kind of quality of the material of the circuit board, but can be constituted in common.

[0024] In addition, a dummy bump's installation position, a configuration, a number, etc. make [many] the number of dummy bumps, so that the impression load according to load stability demanded is so high that there are few bumps for flow connection like the flip chip by which it is good to choose suitably according to the setting load demanded according to the load stability of mounting equipment etc., for example, it is used for an IC card. Moreover, as for a dummy bump's formation position, arranging as equally as

possible is good for the undersurface of a semiconductor chip. In addition, a dummy bump does not necessarily need to be among the bumps for flow connection.

[0025] Moreover, as for dummy bump 5b, it is also good to establish some or all of them in the front face of checking pad 4b which is formed in the undersurface of a semiconductor chip 3 apart from pad 4a, and is used for the performance verification of a semiconductor chip 3, as shown in drawing 3. In this case, the following effect is done so. That is, in what does not form a bump in a checking pad, a front face will expose a checking pad by carrying out etching removal of the UBM film at the time of the above-mentioned bump formation. Since the aluminum which is usually inferior to Au used for a bump in corrosion resistance is used, there is a possibility of receiving a damage in etching of a UBM film, a subsequent washing process, etc., and bringing about corrosion in a checking pad. On the other hand, in what formed the dummy bump in the checking pad, after formation of the above-mentioned UBM film, since the front face of checking pad 4b is not exposed, it can prevent the corrosion of checking pad 4b.

[0026] Moreover, a liquefied thing is also easy to be natural although the anisotropy electric conduction adhesive film is used as anisotropy electric conduction jointing material.

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is drawing showing the semiconductor chip mounting state of the semiconductor device of this invention.

[Drawing 2] It is a perspective diagram by the side of the inferior surface of tongue of the semiconductor chip of the semiconductor device of this invention.

[Drawing 3] It is drawing showing the semiconductor chip mounting state of the modification of the semiconductor device of this invention.

[Drawing 4] It is the decomposition perspective diagram of the example of representation of an IC card.

[Drawing 5] It is drawing showing the example of representation of the semiconductor chip mounting state of the conventional semiconductor device.

[Description of Notations]

1 Circuit Board

2 Circuit Electrode

3 Semiconductor Chip

4b A checking pad

5a Bump

5b Dummy bump

6 Anisotropy Electric Conduction Adhesive Film (Anisotropy Electric Conduction Jointing Material)

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the mounting quality of a semiconductor chip in a semiconductor device.

SOLUTION: In a semiconductor device, an anisotropic conduction joint material 6, which electrically and mechanically connects a circuit electrode 2 and bumps 5a, is installed between the circuit electrode 2 formed on a circuit board 1 and a position facing the circuit electrode 2 at the lower face of a semiconductor chip 3. Dummy bumps 5b are formed in positions facing a part, where the circuit electrode of the circuit board 1 is not formed. When an application load to the semiconductor chip 3 for compressing and deforming the anisotropic conduction joint material 6 is set to a stable high load-side, the load is distributed to the dummy bumps 5b, and the circuit board 1 is prevented from being deformed and the circuit electrode 2 from being disconnected due to the application of excessive load.